



УДК 539.2

Д. А. Закарян

Частичная квазибинарная эвтектика в системе B_4C-SiC

(Представлено академиком НАН України В. В. Скороходом)

С помощью квантово-механических расчетов на основе метода априорного псевдопотенциала доказано, что B_4C-SiC является частично квазибинарной эвтектической системой, где в ряду нерастворимых компонентов (B_4C , SiC) присутствует углерод, который связан с изменением стехиометрического состава B_4C при высоких температурах ($B_{12}C_3 \rightarrow B_{13}C_2$).

Ключевые слова: псевдопотенциал, квазикогерентность, стехиометрический состав.

Ковалентные соединения на основе легких элементов обладают комплексом ценных эксплуатационных свойств и являются основой для создания керамических материалов различного назначения. В связи с этим разработка новых ударостойких эвтектических композиций в системе $Si-B-C$ представляет большой научный и практический интерес. Экспериментально установлен факт образования частично квазибинарной (B_4C-SiC) системы [1–3] эвтектического типа. Данные рентгеноструктурного анализа показывают практическую неизменность параметров элементарной ячейки, что свидетельствует об отсутствии взаимной растворимости компонент рассматриваемой системы. Однако в работе [1] отмечено, что исследования системы проводились в присутствии избытка углерода и истинный состав эвтектики сдвинут в сторону повышения его содержания.

До настоящего времени отсутствуют опубликованные сведения относительно механизма образования квазибинарной эвтектики с наличием избытка или отсутствия чистого углерода в системе (B_4C-SiC).

В данной работе с помощью термодинамических потенциалов, построенных на основе метода априорного псевдопотенциала, проведено исследование по образованию эвтектики, а также механизма появления “лишнего” углерода.

Согласно законам термодинамики, любую систему, что находится при постоянном давлении и объеме, можно описать с помощью термодинамического потенциала Гельмгольца:

$$F = U - TS, \quad (1)$$

© Д. А. Закарян, 2015

где S — энтропия; U — внутренняя энергия электрон-ионной системы твердой фазы; T — температура. Для вычисления энергии U используется метод априорного псевдопотенциала [4], а энтропия компонент вычисляется через их теплоемкость, для чего используются силовые постоянные, рассчитанные с помощью псевдопотенциала [5].

Внутренняя энергия системы представляется в виде суммы

$$U = U^* + U_T,$$

где U^* — энергия электрон-ионной системы при $T = 0$, а U_T — энергия тепловых колебаний ионов при $T \neq 0$.

Энергию электрон-ионной системы U^* для любой фазы, в рамках метода псевдопотенциала, можно записать в виде [4]

$$U^* = U_0 + U_S, \quad (2)$$

где в U_0 включены: кинетическая энергия свободного электронного газа, обменно-корреляционные эффекты, энергия заряженных ионов, а также энергия электронов в первом порядке теории возмущений по псевдопотенциальному [4]; U_S — сумма энергии зонной структуры и электростатической энергии, которую можно представить в виде суммы парных межатомных потенциалов:

$$U_S = \frac{1}{N} \sum_{i,j} \Phi(R_i - R_j), \quad (3)$$

где $R_i - R_j$ — расстояние между атомами i и j ; N — число атомов в представительном объеме [5, 6].

Для системы, состоящей из двух компонент A и B , энергия U_S равна

$$U_S = \frac{c_A^2 U_{AA} + c_B^2 U_{BB} + 2c_A c_B U_{AB}}{2}, \quad (4)$$

где U_{AA} , U_{BB} , U_{AB} — соответственно энергии взаимодействия между молекулами $A-A$ ($\text{B}_4\text{C}-\text{B}_4\text{C}$), $B-B$ ($\text{SiC}-\text{SiC}$), $A-B$ ($\text{B}_4\text{C}-\text{SiC}$) (c_A , c_B — концентрация компонент A и B). Для любой фазы U_0 имеет вид

$$U_0 = c_A U_A + c_B U_B. \quad (5)$$

Здесь U_A и U_B — энергия свободного электронного газа компонент $A - B$.

Полный термодинамический потенциал с учетом температурной части энергии имеет вид

$$F = U_T + U_0 + U_S - TS. \quad (6)$$

Энтропию компонентов можно вычислить через теплоемкость исходя из соотношения [7]

$$dST = C_\Omega dT. \quad (7)$$

Теплоемкость можно определить двумя приближенными методами:

1) методом Дебая (континуальное приближение), где учитываются лишь акустические колебания, которые характеризуются одинаковой скоростью звука;

2) методом Эйнштейна, в котором всем колебаниям приписывается одна и та же частота.

Отметим, что модель Дебая лучше работает в области низких температур, а модель Эйнштейна хорошо описывает теплоемкость кристаллов при комнатных и более высоких температурах [6].

Значения теплоемкости в модели Дебая и Эйнштейна мало отличаются друг от друга, кроме области малых температур. Так как температура в точке эвтектики для исследуемой системы выше 2000 К, то применение приближения Эйнштейна является корректным.

Для энергии тепловых колебаний (приходящейся на одну молекулу) при температуре T имеем [7]

$$U_T = \frac{\hbar\omega}{\exp\left(\frac{\hbar\omega}{kT} - 1\right)}. \quad (8)$$

Определяем теплоемкость C_Ω (при постоянном объеме) через энергию колебаний решетки [6]

$$C_\Omega = \left(\frac{dU_T}{dT} \right)_\Omega = Nk \frac{(\hbar\omega/kT)^2 \exp(\hbar\omega/kT)}{((\exp(\hbar\omega/kT) - 1)^2}. \quad (9)$$

Частота колебаний определяется по формуле [7]

$$\omega = \sqrt{\frac{2\alpha^*}{M}}, \quad (10)$$

где M — масса атома (молекулы); α^* — силовая постоянная, которая определяется через вторую производную энергии межатомного (межмолекулярного) взаимодействия по пространственной переменной $\alpha^* = (\partial^2 U / \partial r^2)$. Получены следующие значения частоты (10) колебаний молекул компонент: SiC — $\omega = 0,012395 \cdot 10^{13}$ с⁻¹; B₄C — $\omega = 0,012855 \cdot 10^{13}$ с⁻¹.

В итоге термодинамический потенциал представляется как функция от двух параметров — концентрации компонент (C) и температуры (T), где $C = c_A$, а $1 - C = c_B$.

Концентрацию компонент в системе $A - B$, а также температуру в точке эвтектики определяем из условия

$$\frac{\partial F(C, T)}{\partial C} = 0; \quad \frac{\partial F(C, T)}{\partial T} = 0, \quad (11)$$

из которого имеем систему алгебраических уравнений с двумя неизвестными C_E и T_E . Решая эту систему уравнений, получаем концентрацию C_E и температуру T_E в точке эвтектики.

В ходе вычислительного эксперимента оказалось, что система (11) не имеет решения при условии, когда суммарная концентрация двух компонент равна единице.

Для решения данной проблемы проведен вычислительный эксперимент в контексте изменения процентного соотношения компонент B₄C и SiC. Была подобрана возможная сумма концентрации двух компонент, равная $c_A + c_B \approx 0,95$. Это означает, что для получения эвтектики в системе необходимо наличие третьего элемента с малой концентрацией (~ 5%). Третьим компонентом может быть Si, C или B. В результате получено: $c_A = 0,628$ (B₄C), $c_B = 0,32$ (SiC), а температура в точке эвтектики $T_E = 2550$ К, что находится в пределах точности экспериментальных данных [1-3].

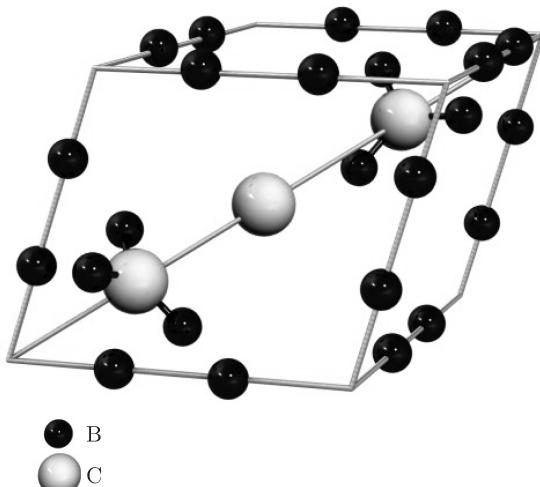


Рис. 1. Кристаллическая решетка B_4C

Результаты проведенных вычислительных экспериментов подтверждают, что эвтектики представляют собой единую систему взаимодействующих фаз [8]. Взаимную ориентировку эвтектических фаз необходимо связывать с условием обеспечения минимальной межкомпонентной энергии, т. е. энергии поверхности раздела компонент. Минимум межфазной энергии достигается, когда сочетание симметрии, ориентации и параметров решеток двух кристаллов отвечает условию наибольшего количества атомных совпадений. Связь между компонентами осуществляется с помощью общих атомов компонент или кластеров, образующихся из их атомов на границе стыковки. В данном случае для исследуемой системы связь осуществляется с помощью общих атомов углерода.

Известно, что B_4C имеет широкую область гомогенности. У карбида бора ромбоэдрическая структура с параметром решетки $a = 0,519$ нм (рис. 1). Элементарная ячейка содержит 15 атомов: 3 атома углерода занимают места на тригональной оси ромбоэдра, центральный атом связан с двумя соседними атомами углерода. Карбид бора, как фаза, имеет переменный состав (содержание углерода в ней колеблется от 8,6 до 21,40%) [9]. Есть предположение, что изменение состава карбида бора происходит вследствие того, что атомы бора замещают часть атомов углерода на тригональной диагонали ромбоэдра (вместо цепочки C–C–C имеем C–B–C), т. е. кристаллы карбида бора с составом $B_{13}C_2$. $B_{13}C_2$ обладает самой высокой температурой плавления [9]. У атома бора для связей имеется три валентных электрона — $2s^12p^2$, а у углерода четыре — $2s^22p^2$. Связь между атомами углерода и бора с электронным дефицитом можно объяснить, если считать, что в веществах с ковалентной связью электрон участвует в связях попеременно. В B_4C расстояние между атомами равно: C–C 0,137 нм; C–B 0,163 нм; B–B 0,174–0,180 нм. В SiC расстояние между атомами Si–C составляет 0,175 нм. Отсюда можно сделать следующий вывод: для обеспечения квазикогерентного контакта границ стыковки двух компонент надо взять те атомы углерода, которые в компоненте B_4C связаны с бором. При составе $B_{12}C_3$ в элементарной ячейке (см. рис. 1) центральный атом углерода не может быть общим из-за разности расстояния между атомами в двух компонентах. Гораздо удобнее, если центральный атом углерода заменен бором, т. е. $B_{12}C_3 \rightarrow B_{13}C_2$. Так как, элементарная ячейка B_4C содержит 15 атомов, а SiC — 8, то доля одного атома в системе составляет 4,3%. При изменении

стехиометрического состава $B_{12}C_3 \rightarrow B_{13}C_2$ оценим число отпадающих атомов углерода. Используя уравнение

$$B_{12}C_3 = x B_{13}C_2 + y C, \quad (12)$$

где x и y — неизвестные величины, характеризующие состав элементов, сравниваем число атомов бора и углерода до и после изменений стехиометрического состава. В результате получаем систему линейных уравнений:

$$13x = 12; \quad (I)$$

$$2x + y = 3, \quad (II)$$

где I — уравнение для вычисления число атомов бора, II — для атомов углерода. В итоге число атомов углерода оказывается лишним при изменении стехиометрического состава карбида бора $y = 1,15$ (т. е. от каждой элементарной ячейки отпадает 1,15 атома углерода). Зная о том, что каждому атому в системе соответствует 4,3%, можно легко оценить процентное содержание лишнего углерода — 4,3 $y = 4,95\%$.

На основании результатов исследования можно сделать следующие выводы.

Карбид кремния и карбид бора образуют эвтектическую систему, которую можно называть частично квазибинарной из-за выделения углерода.

Композиционный материал SiC– B_4C имеет минимальную внутреннюю энергию, когда граница стыковки фаз является квазикогерентной, а это осуществляется при изменении стехиометрического состава B_4C . В новом составе имеются лишние атомы углерода, концентрация которых составляет 4,95% (ат.).

Цитированная литература

1. Shaffer P. T. The SiC phase in the system SiC– B_4C –C // Mater. Res. Bull. – 1969. – 4, No 3. – P. 213–220.
2. Hong J. D., Spear K. E., Stibican V. S. Directional solidification of SiC– B_4C eutectic: Growth and some properties // Mater. Res. Bull. – 1979. – 14, No 6. – P. 775–783.
3. Gunjshima I., Akashi T., Goto T. Characterization of directionally solidified B_4C –SiC composites prepared by a floating zone method // Mater. Trans. – 2002. – 43, No 9. – P. 3309–2315.
4. Zakarian D., Kartuzov V., Kartuzov E., Khachatrian A., Sayir A. Calculation of composition in LaB_6 – TiB_2 , LaB_6 – ZrB_2 eutectics by means of pseudopotential method // J. Eur. Ceram. Soc. – 2011. – 31, No 7. – P. 1305–1308.
5. Heine Y., Cohen M., Weaire D. The Pseudopotential Concept. – New York, London: Academic Press, 1970. – 584 p.
6. Zakarian D. A. Kartuzov V. V., Khachatrian A. V. Pseudopotential method for calculating the eutectic temperature and concentration of the components of the B_4C – TiB_2 , TiB_2 –SiC, and B_4C –SiC systems // Powder Metallurgy and Metal Ceramics. – 2009. – 48, No 9–10. – P. 588–594.
7. Kittel Ch. Introduction to Solid State Physics. – New York: Wiley, 1978. – 775 p.
8. Закарян Д. А. Механические характеристики квазибинарных эвтектических композитов с учетом влияния межкомпонентного взаимодействия на границе раздела // Доп. НАН України. – 2014. – № 12. – С. 86–90.
9. Кислы́й П. С., Кузенкова М. А., Боднарук Н. И., Грабчук Б. Л. Карбид бора. – Киев: Наук. думка, 1988. – 216 с.

References

1. Shaffer P. T. Mater. Res. Bull., 1969, **4**, No 3: 213–220.
2. Hong J. D., Spear K. E., Stubican V. S. Mater. Res. Bull., 1979, **14**, No 6: 775–783.
3. Gunjshima I., Akashi T., Goto T. Mater. Trans., 2002, **43**, No 9: 3309–3315.
4. Zakarian D., Kartuzov V., Kartuzov E., Khachatrian A., Sayir A. J. Eur. Ceram. Soc., 2011, **31**, No 7: 1305–1308.
5. Heine Y., Cohen M., Weaire D. The Pseudopotential Concept, New York, London: Academic Press, 1970.
6. Zakarian D. A., Kartuzov V. V., Khachatrian A. V. Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2009, **48**, No 9–10: 588–594.
7. Kittel Ch. Introduction to Solid State Physics., New York: Wiley, 1978.
8. Zakarian D. A. Dop. NAN Ukraine, 2014, No 12: 86–90 (in Russian).
9. Kisliy P. S., Kuzenkova M. A., Bodnaruk N. I., Grabchuk B. L. Boron carbide, Kiev: Nauk. dumka, 1988 (in Russian).

Інститут проблем матеріаловедення
ім. І. Н. Францевича НАН України, Київ

Поступило в редакцію 03.07.2015

Д. А. Закарян

Часткова квазібінарна еутектика в системі B_4C-SiC

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, Київ

За допомогою квантово-механічних розрахунків на основі методу апріорного псевдопотенціалу доведено, що B_4C-SiC є частковою квазібінарною еутектичною системою, де в ряду нерозчинних компонентів (B_4C , SiC) присутній вуглець, який пов'язаний зі зміною стехіометричного складу B_4C при високих температурах ($B_{12}C_3 \rightarrow B_{13}C_2$).

Ключові слова: псевдоптенціал, квазікогерентність, стехіометричний склад.

D. A. Zakarian

Partial quasibinary eutectic in the system B_4C-SiC

I. M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the NAS of Ukraine, Kiev

Using quantum-mechanical calculations on the basis of an a priori pseudopotential, it is proved that B_4C-SiC is a partial quasibinary eutectic system, where a number of insolubles (B_4C , SiC) contain carbon, which is linked to a change of the stoichiometric composition of B_4C at high temperatures ($B_{12}C_3 \rightarrow B_{13}C_2$).

Keywords: pseudopotential, quasi-coherent, stoichiometric composition.